

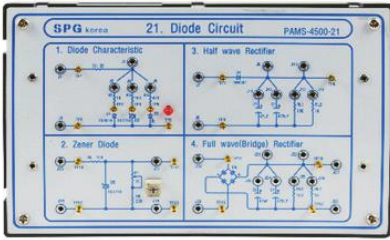
전자회로응용 모듈 실습장비(20종) | MSN-4501



| 제품 특징 |

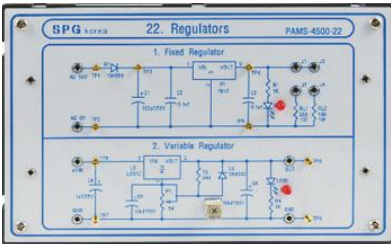
- 전자회로 실습장치의 학습 패키지는 산업현장에서 발생하는 문제점 해결을 위한 지식과 기술을 습득할 수 있는 교육과정 제공 가능
- 실습 모듈은 NCS “전자기기생산 L2 교육훈련용”에 부합해야 하고 세분류인 “자제품생산”과 능력단위 “전자제품제조”에 부합하여 전자회로 개념 실습과 회로측정실습 가능하도록 모듈별로 구성
- 계측장비를 이용하여 전자회로 각 모듈의 특성 측정 실험 실습 가능
- 기초 전자회로 구성은 모듈20종 다이오드 회로, 전압 정류기 특성 실험, BJT 바이어스 회로, BJT 증폭기 - 1,2, 전력증폭기, FET 특성 실험, FET Application 실습, MOS-FET & IGBT 회로, 사이리스터 회로, 발진기 회로, OP-AMP 회로, 미분기와 적분기, OP Amp 가산기 & 감산기, OP-AMP 응용 회로, SENSOR 회로 실험 - 1,2, 전원공급기 20개 모듈로 되어 있음
- 2개 이상의 모듈을 연결하여 연계된 회로 실험 실습 가능
- 각 모듈은 특성 측정을 위하여 주요 위치마다 TEST Pin이 있어 오실로스코프 및 멀티테스터기로 데이터 측정 가능
- 실습용 모듈을 이용한 16주 이상의 강의용 교재가 제공 및 각 실습에 따른 모범 답안을 제공
- 실습 모듈에 전원공급기 모듈이 포함
- 브레드보드를 이용하여 회로구성이 가능





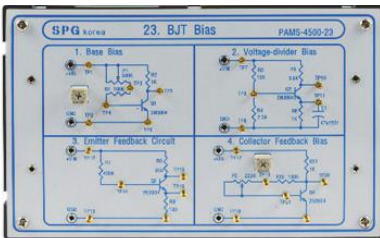
4500-21 (Diode Circuit)

- 다이오드 회로 특성 실험
- 제너 / LED 다이오드 특성 회로 실험
- Test Pin × 17개, 2Ø 단자 × 28개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



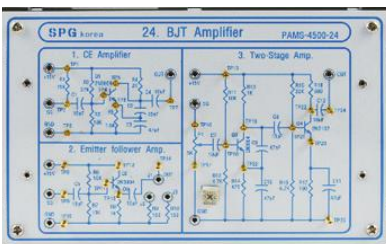
4500-22 (Regulators)

- 전압 정류기 회로 특성 실험
- 정전압 IC를 사용한 안정화 전원 회로 실험
- 전압 가변형 안정화 전원 회로 실험
- Test Pin × 9개, 2Ø 단자 × 10개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



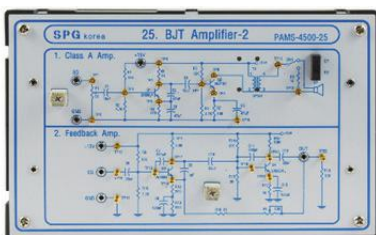
4500-23 (BJT Bias)

- BJT 바이어스 회로 특성 실험
- 고정, 전압분배 회로 실험
- 전류귀환 바이어스 회로 실험
- Test Pin × 21개, 2Ø 단자 × 8개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



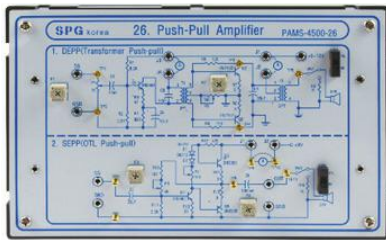
4500-24 (BJT Amplifier)

- BJT 증폭기 -1 회로 특성 실험
- BJT 에미터플로워 회로 실험
- BJT 1, 2단 증폭 회로 실험
- Test Pin × 25개, 2Ø 단자 × 14개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



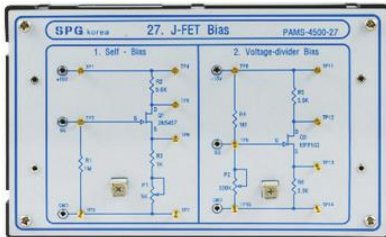
▶ 4500-25 (BJT Amplifier-2)

- 릴레이 종류별 특성 실습 (2종)
- BJT 궤환 증폭 회로 실험
- A급 전력 증폭 회로 실험
- Test Pin × 22개, 2Ø 단자 × 7개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



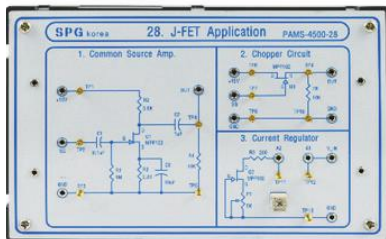
4500-26 (Push-Pull Amplifier)

- 전력증폭기 회로 특성 실험
- Push-Pull 증폭기 회로 실험 (DEPP, SEPP)
- Test Pin × 11개, 2Ø 단자 × 13개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



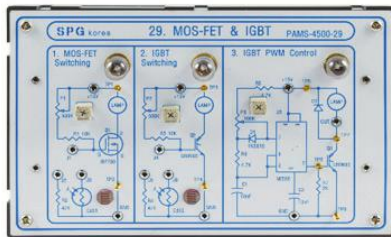
4500-27 (J-FET Bias)

- J-FET 회로 특성 실험
- 자기 바이어스 회로 실험
- 전압분배 바이어스 회로 실험
- Test Pin × 14개, 2Ø 단자 × 6개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



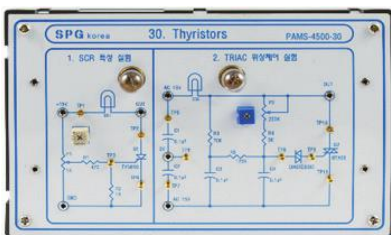
4500-28 (J-FET Application)

- J-FET Application 회로 특성 실험
- FET 증폭 회로 실험
- FET 초퍼 회로 실험
- FET 정전류 증폭 회로 실험
- Test Pin × 14개, 2Ø 단자 × 6개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



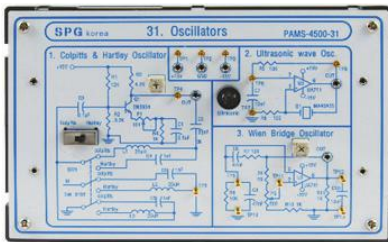
4500-29 (MOS-FET & IGBT)

- MOS-FET & IGBT 회로 특성 실험
- DC Switching 회로 실험
- IGBT 의한 PWM 제어 회로 실험
- Test Pin × 8개, 2Ø 단자 × 13개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



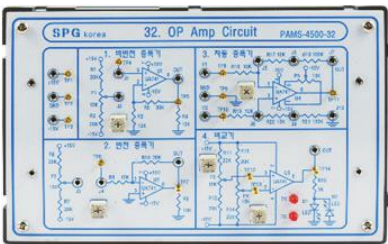
4500-30 (Thyristors)

- 사이리스터 회로 특성 실험
- SCR 전류제어 회로 실험
- TRIAC 위상제어 회로 실험
- Test Pin × 11개, 2Ø 단자 × 7개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



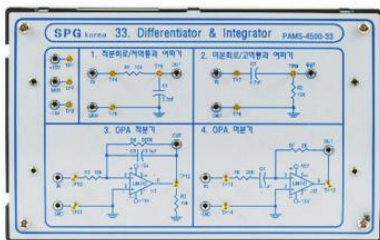
4500-31 (Oscillators)

- 발진기 회로 특성 실험
- 콜피츠, 하틀리 발진기 회로 실험
- Wien Bridge 발진기 회로 실험
- Test Pin × 13개, 2Ø 단자 × 6개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



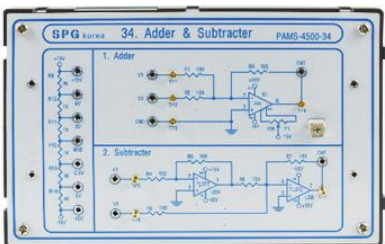
4500-32 (OP AMP Circuit)

- OP-AMP 회로 특성 실험
- 반전 증폭, 비반전 증폭 회로 실험
- 차동, 비교기 회로 실험
- Test Pin × 14개, 2Ø 단자 × 19개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



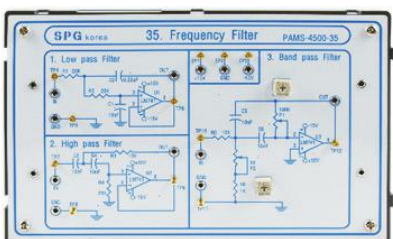
4500-33 (Differentiator & Integrator)

- 미분기 & 적분기 회로 특성 실험
- RC 미적분기 회로 실험
- 능동 미적분기 회로 실험
- Test Pin × 15개, 2Ø 단자 × 15개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



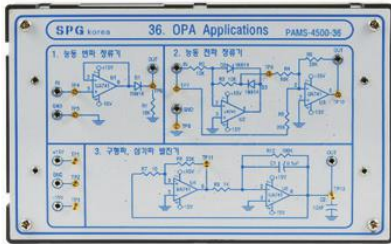
4500-34 (Adder & Subtractor)

- OP Amp 가산기 & 감산기 회로 특성 실험
- OP Amp의 가산기 회로 실험
- OP Amp의 감산기 회로 실험
- Test Pin × 7개, 2Ø 단자 × 14개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



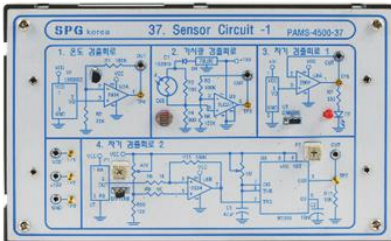
4500-35 (Frequency Filter)

- 여파기 회로 특성 실험
- LPF, HPF, BPF 회로 실험
- 수동/능동 여파기 회로 실험
- Test Pin × 12개, 2Ø 단자 × 12개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



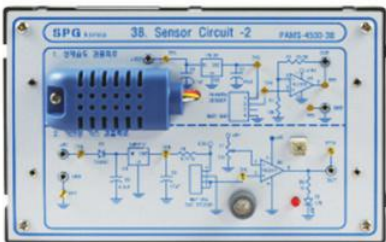
4500-36 (OPA Applications)

- OP-AMP 응용 회로 특성 실험
- 정류기, 계측증폭기, 구형파, 삼각파 발진기 회로 실험
- Test Pin × 12개, 2Ø 단자 × 10개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



4500-37 (Sensor Circuit-1)

- Sensor 회로 특성 실험 - 1
- 온도 센서 회로 실험
- 광센서 회로 실험
- 자기센서 회로 실험
- Test Pin × 7개, 2Ø 단자 × 7개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



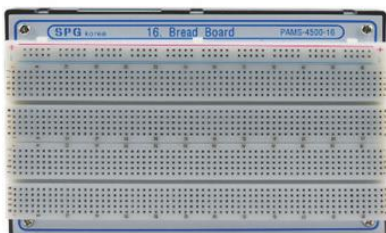
4500-38 (Sensor Circuit-2)

- Sensor 회로 특성 실험 - 2
- 습도 센서 회로 실험
- 가스 회로 실험
- Test Pin × 10개, 2Ø 단자 × 6개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



4500-40 (Power Supply)

- 전원 공급기 • 입력 : AC100 ~ 240V
- 출력 : DC +15V (0.5A), -15V (0.5A)
- 전원 S,W × 1개 • 휴즈 홀더 × 1개
- Test Pin × 7개, 2Ø 단자 × 3개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm

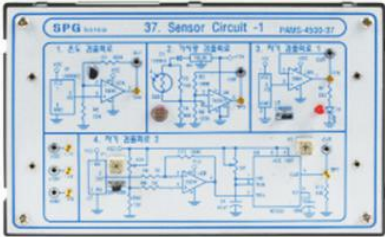


4500-16 (Bread Board)

- 브레드보드 모듈
- Bus × 2개, Power Bus × 1개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm
- 멀티 사출케이스

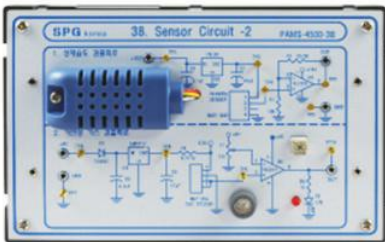
센서회로응용 모듈 실습장비(9종) | PAMS-4500S

센서 모듈



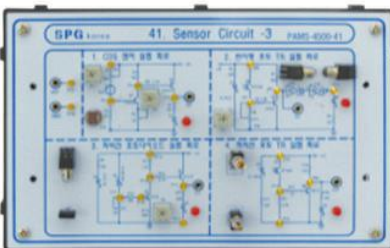
4500-37 (Sensor Circuit-1)

- Sensor 회로 특성 실험 - 1
- 온도 센서 회로 실험
- 광센서 회로 실험
- 자기 센서 회로 실험
- Test Pin × 7개, 2Ø 단자 × 7개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



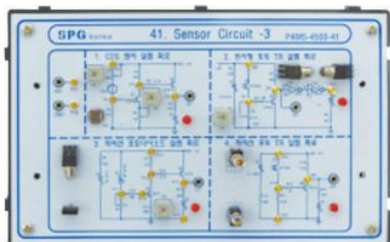
4500-38 (Sensor Circuit-2)

- Sensor 회로 특성 실험 - 2
- 습도 센서 회로 실험
- 가스 회로 실험
- Test Pin × 10개, 2Ø 단자 × 6개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



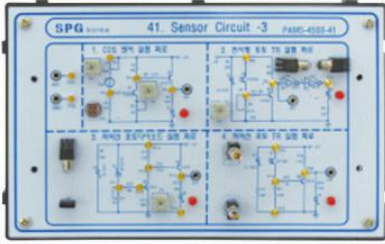
4500-41 (Sensor Circuit-3)

- Sensor 회로 특성 실험 - 3
- CDS 센서 회로 실험
- 반사형 포토 TR 회로 실험
- 적외선 포토다이오드 회로 실험
- 적외선 포토 TR 회로 실험
- Test Pin × 18개, 2Ø 단자 × 6개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



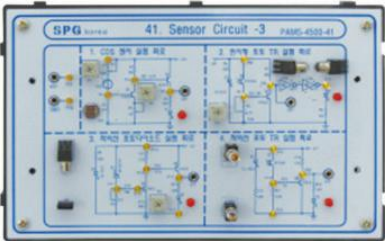
4500-42 (Sensor Circuit-4)

- Sensor 회로 특성 실험 - 4
- Photo Interrupt 회로 실험
- Photo Coupler 회로 실험
- Color Sensor 회로 실험
- Test Pin × 4개, 2Ø 단자 × 4개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



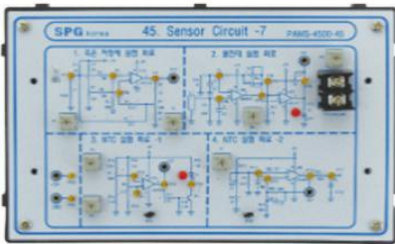
4500-43 (Sensor Circuit-5)

- Sensor 회로 특성 실험 - 5
- 레이저 다이오드 센서 회로 실험
- 적외선 센서 회로 실험
- Test Pin × 3개, 2Ø 단자 × 4개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



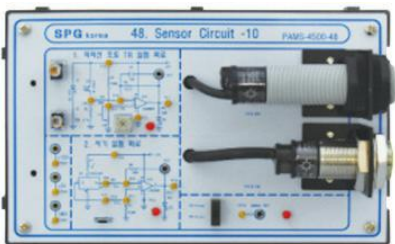
4500-44 (Sensor Circuit-6)

- Sensor 회로 특성 실험 - 6
- 광 화이버 센서 (BF3RX), 스위칭 회로 (릴레이 접점 제어용) 실험
- Test Pin × 37개, 2Ø 단자 × 4개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



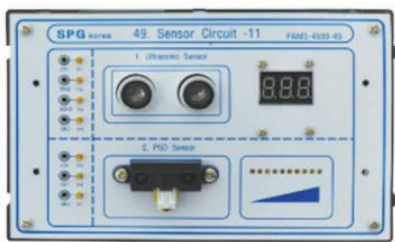
4500-03 (Capacitor Types)

- Sensor 회로 특성 실험 - 7
- 축온 저항체 온도 센서 회로 실험
- 열전대 회로 실험
- NTC-1 회로 실험
- NTC-2 회로 실험
- Test Pin × 19개, 2Ø 단자 × 5개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



4500-49 (Sensor Circuit-10)

- Sensor 회로 특성 실험 - 10
- 유도형 근접센서 회로 실험
- 용량형 근접센서 회로 실험
- 적외선 포토 TR 회로 실험
- 자기 회로 실험
- Test Pin × 16개, 2Ø 단자 × 6개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm



4500-48 (Sensor Circuit-11)

- Sensor 회로 특성 실험 - 11
- 초음파 센서 실험
- 측정거리 표시기 FND 내장
- 적외선 (PSD)센서 실험
- 측정거리 표시기 LED 내장
- Test Pin × 7개, 2Ø 단자 × 7개
- 크기 : 165(W) x 105(D) x 33(H)mm